

## 使用 4 端子法测量导电性材料的体积电阻率和表面电阻率 RM0002-2022C02

使用 4 端子法测量导电性材料的体积电阻率、表面电阻率和电导率。

### 要点

- 4 端子法是指使用 4 针探头，从运用 4 端子法测到的电阻值中求出体积电阻率、表面电阻率（薄层电阻）。使用电阻计 RM3545、4 针探头和 PC 应用软件实现 4 端子测量。
  - 4 针探头有两种，针距 1.5mm 和 5.0mm。
  - 测量单位为体积电阻率、表面电阻率和电导率。也可以作为参考值来选择电阻值。
  - 从输入的测试样品的尺寸和坐标，还能显示所计算补偿系数。· 装有符合 JIS K 7194 标准的测量模式（使用 5.0mm 针探头时）
- ※关于标准的详细内容请另外咨询。
- 具备探测位置的引导显示，测量历史的显示，测量结果的 CSV 输出等应用程序特有的便利性。
  - 以基本精度 0.006%，最高分辨率 0.01 $\mu\Omega$ （RM3545 的参数）来测量低电阻值。从而导出高精度的体积电阻率。



### 使用仪器

- 电阻计 RM3545
- 4 探针探头（间距 5.0mm）
- 4 探针探头（间距 1.5mm）

※记载的内容是根据 2018 年 2 月发行的仪器型号。可能在产品款式上有更改，请以现在发行的为准。